依賴試験手数料•使用料

		区分			単位	手数料及び使用料の金額(単位:円)			
種別						市内 中小企業	市内大企業 (1.3倍)	市外企業 (1.5倍)	
		塩水噴霧試験機による	依頼者による場合			1試料24時間につき	1,600	2,100	2,400
	環境試験	もの	その他の場合			1試料24時間につき	2,900	3,800	4,400
		恒温恒湿試験器によるもの	依頼者による場合			1試料24時間につき	900	1,200	1,400
			その他の場合			1試料24時間につき	2,700	3,600	4,100
		キャピラリ電気泳動装置	量によるもの			1試料につき	5,200	6,800	7,800
		その他の環境試験	一般的なもの			1試料24時間につき	1,000	1,300	1,500
			複雑なもの			1試料24時間につき	3,300	4,300	5,000
		厚さ試験	蛍光X線膜厚計によるもの	一般的なもの	依頼者による場合	1試料1測定点につき	1,300	1,700	2,000
					その他の場合	1試料1測定点につき	2,400	3,200	3,600
				複雑なもの		1試料1測定点につき	6,100	8,000	9,200
			電解式膜厚計によるもの		1試料1測定点につき	2,700	3,600	4,100	
		粗さ・段差測定	触針式表面形状測定器によるもの			1試料1測定点につき	4,100	5,400	6,200
			ボールオンディスクによるもの(摩擦摩	依頼者による場合		1試料につき	1,300	1,700	2,000
		摩擦・硬さ試験	耗試験機によるものを除く。)	その他の場合		1試料につき	8,000	10,400	12,000
			摩擦摩耗試験機によるもの			1試料につき	9,100	11,900	13,700
物理試験			硬さ試験機によるもの			1試料につき	6,000	7,800	9,000
		n*4 /****	摩擦摩耗試験機によるもの			1試料につき	10,200	13,300	15,300
		密着性•付着性試験	接触角計によるもの			1試料1測定点につき	4,300	5,600	6,500
	n++ = 1 mA	n+ l	皮膜抵抗器によるもの	依頼者による場合		1試料1測定点につき	800	1,100	1,200
		皮膜抵抗試験		その他の場合		1試料1測定点につき	1,100	1,500	1,700
		測色試験	測色計によるもの	依頼者による場合		1試料1測定点につき	800	1,100	1,200
				その他の場合		1試料1測定点につき	1,100	1,500	1,700
		透過率測定	分光光度計によるもの	依頼者による場合		1試料1測定点につき	900	1,200	1,400
				その他の場合		1試料1測定点につき	1,200	1,600	1,800
		膜厚•光学定数測定	エリプソメータによるもの			1試料1測定点につき	6,400	8,4	100
		表面観察	- /	表面観察		1試料1測定点につき	700	1,000	1,100
			マイクロスコープによるもの	計測を伴うもの		1試料1測定点につき	1,100	1,500	1,700
			3D表面観察装置によるもの		1試料1測定点につき	1,000	1,300	1,500	
		試験試料の作製	切削加工			1試料につき	1,300	1,700	2,000
			樹脂埋め・研磨加工	一般的なもの		1試料につき	4,100	5,400	6,200
				複雑なもの		1試料につき	9,500	12,400	14,300
化学	^全 分析	が めっき液分析 金属等組成分析(添加剤の分析を除く。)				1試料1成分につき	2,300	3,000	3,500
	定性分析そ の他の一般 的なもの	電子線マイクロアナライザによるもの				1試料1測定点につき	10,800	14,100	16,200
			定性分析		1測定点の追加(同一試 料に限る。)	4,500	5,900	6,800	
					写真1枚につき	2,900	3,800	4,400	
			定性分析	一般的なもの	依頼者による場合	1試料1測定点につき	1,600	2,100	2,400
					その他の場合	1試料1測定点につき	7,600	9,900	11,400
表面分析				複雑なもの	•	1試料1測定点につき	9,800	12,800	14,700
		走査型電子顕微鏡によるもの	主 而 細 安		1試料1測定点につき	5,700	7,500	8,600	
			表面観察			1測定点の追加(同一試 料に限る。)	1,600	2,100	2,400
			定性分析	エネルギー分散型分光器によるもの		1試料1測定点につき	8,400	11,000	12,600
						1測定点の追加(同一試料に限る。)	1,600	2,100	2,400

依賴試験手数料•使用料

種別		区分			単位	手数料及び使用料の金額(単位:円)		
						市内 中小企業	市内大企業 (1.3倍)	市外企業 (1.5倍)
	定性分析その他の一般的なもの	X線回折装置によるもの	定性分析		1試料1測定点につき	12,900	16,800	19,400
		熱分析装置によるもの	定性分析		1試料につき	11,800	15,400	17,70
		フーリエ変換赤外分光 分析計によるもの	定性分析	依頼者による場合	1試料1測定点につき	3,400	4,500	5,10
				その他の場合	1試料1測定点につき	9,900	12,900	14,900
		電子線マイクロアナライザ 及びフーリエ変換赤外分光 分析計によるもの	異物分析		1試料につき	16,700	21,800	25,100
		電子線マイクロアナライ ザによるもの	線分析・マッピング		1試料1測定点につき(3元 素以内の測定に限る。)	30,500	39,700	45,80
					1測定元素の追加(同一 測定点に限る。)	5,400	7,100	8,10
			簡易測定(ワイドスキャン)		1試料1測定点につき	22,100	28,800	33,20
			状態分析		1試料1測定点につき(3元 素以内の測定に限る。)	27,700	36,100	41,60
		X線光電子分光分析装置によるもの			1測定元素の追加(同一測定点に限る。)	5,300	6,900	8,00
+ 1, 4r			深さ方向分析深さ方向分析		1試料1測定点につき(3元 素以内の測定に限る。)	36,400	47,400	54,60
表面分析					1測定元素の追加(同一 測定点に限る。)	5,300	6,900	8,00
		グロ―放電発光分光分 析装置によるもの			1試料1測定点につき	15,300	19,900	23,00
		走査型電子顕微鏡によ るもの	マッピング	エネルギー分散型分光器によるもの	1試料1測定点につき(3元 素以内の測定に限る。)	25,100	32,700	37,70
					1測定元素の追加(同一 測定点に限る。)	1,700	2,300	2,60
		走査型プローブ顕微鏡 によるもの	原子間力顕微鏡による表面観察		1試料1測定点につき	22,600	29,400	33,90
			原子間力顕微鏡による表面粗さ観察		1試料1測定点につき	22,600	29,400	33,90
		試験試料の作製	カーボンコーティング		1試料につき	700	1,000	1,10
			金コーティング		1試料につき	4,100	5,400	6,20
			白金コーティング		1試料につき	5,500	7,200	8,30
			断面作製		1試料につき	16,600	21,600	24,90
			集束イオンビーム加工観察装置によるもの		1試料1加工面につき	19,100	24,9	000
					1加工面の追加(同一試 料に限る。)	9,500	12,400	
	グラフィックデザイン					10,400	13,600	15,60
	イン調製	プロダクトデザイン			1件4時間につき	15,400	20,100	23,10
			3Dプリンターによる試作	依頼者による場合	1件1時間につき	1,300	1,700	2,00
デザ				その他の場合	1件1時間につき	5,000	6,500	7,50
		商品企画デザイン	3Dデータの作成又は修正	依頼者による場合	1件1時間につき	500	700	80
				その他の場合	1件1時間につき	4,100	5,400	6,20
			その他の商品企画デザイン		1件4時間につき	17,700	23,100	26,60
機械又は器具の使用 モデル製作工房・工作室の使用				1日につき	3,700	4,900	5,60	
証明書発:	 行			1枚につき	300	300	30	

(備考)

- 2 試験、分析又は調製について特別の材料、労力等を必要とするもの及び研究又は調査の手数料の額は、実費相当額とする。
- 3 特に期限を定め急を要するものの手数料又は使用料の額は、表及び2に定める額の2倍の額とする。
- 4 市内に事務所若しくは事業所を有する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者以外の者からの依頼に係る手数料若しくは使用料又は市内に事務所若しくは事業所を有しない者であって、同項各号に掲げる者以外の者からの依頼に係る膜厚・光学定数測定による皮膜試験若しくは集東イオンビーム加工観察装置による試験試料の作製に係る手数料の額は、表、2及び3に定める額の1.3倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
- 5 市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない個人若しくは法人その他の団体からの依頼に係る手数料(膜厚・光学定数測定による 皮膜試験及び集束イオンビーム加工観察装置による試験試料の作製に係るものを除く。)又は使用料の額は、表、2及び3に定める額の1.5倍の額(100円未満の 端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。